

Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-20522-01-00 nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Gültig ab: 25.01.2024

Ausstellungsdatum: 25.01.2024

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:

SRC Security Research and Consulting GmbH
Emil-Nolde-Straße 7, 53113 Bonn

Mit folgenden Standorten

SRC Security Research and Consulting GmbH
Emil-Nolde-Straße 7, 53113 Bonn

Das Prüflaboratorium erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser Anlage aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen. Das Prüflaboratorium erfüllt gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschließlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdrücklich bestätigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für Prüflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Prüfungen in den Bereichen:

- 1) Prüfungen von Produkten aus dem Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik (ICT)**

Das Labor erbringt die Prüfung anhand folgender Prüfverfahren

Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der gültigen und überwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-20522-01-00

1. Durchführung von Seitenkanalprüfungen; Standard Operating Procedure (SOP) des Prüflabors SRC
2. Prüfverfahren deterministischer Zufallszahlengenerator; Standard Operating Procedure (SOP) des Prüflabors SRC

Basierend auf

- ISO/IEC 15408-1:2009, ISO/IEC 15408-2:2008, ISO/IEC 15408-3:2008
- ISO/IEC 18045:2008
- ISO/IEC 15408:2022
- ISO/IEC 18045:2022
- ISO/IEC TS 23532-1:2021

Die Prüfungen erfolgen bei nachfolgenden Technologien und anhand nachfolgender Assurance Families. Alle Protection Profiles, deren Anforderungen gleich hoch sind wie oder unter den hier gelisteten EAL Niveaus liegen, können bewertet werden. Etwaige Anforderungen an die Assurance Class „Life-cycle support“ (ALC) innerhalb eines Protection Profiles sind dabei nicht zu berücksichtigen.

Die Assurance Class ALC wird nicht durch das Prüflabor betrachtet, die Ergebnisse sind jedoch in die Prüfung zu integrieren.

Zulässige Assurance Family Prüfungen	Prüfobjektgruppen (Target of Evaluation)	Maximales Assurance Family Level	Ausreichend für EAL (informativ)
APE_INT	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	-
APE_CCL	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	-
APE_SPD	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	-
APE_OBJ	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	2	-
APE_ECD	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	-
APE_REQ	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	2	-
ACE_INT	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	-

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-20522-01-00

Zulässige Assurance Family Prüfungen	Prüfobjektgruppen (Target of Evaluation)	Maximales Assurance Family Level	Ausreichend für EAL (informativ)
ACE_CCL	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	-
ACE_SPD	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	-
ACE_OBJ	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	2	-
ACE_ECD	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	-
ACE_REQ	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	2	-
ACE_MCO	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	-
ACE_CCO	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	-
ADV_ARC	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	7
ADV_FSP	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	6	7
ADV_IMP	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	2	7
ADV_INT	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	3	7
ADV_SPM	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	7
ADV_TDS	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	6	7
ADV_COMP	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	7

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-20522-01-00

Zulässige Assurance Family Prüfungen	Prüfobjektgruppen (Target of Evaluation)	Maximales Assurance Family Level	Ausreichend für EAL (informativ)
AGD_OPE	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	7
AGD_PRE	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	7
ASE_CCL	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	7
ASE_ECD	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	7
ASE_INT	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	7
ASE_OBJ	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	2	7
ASE_REQ	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	2	7
ASE_SPD	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	7
ASE_TSS	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	7
ASE_COMP	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	7
ATE_COV	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	3	7
ATE_DPT	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	4	7
ATE_FUN	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	2	7
ATE_IND	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	3	7

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-20522-01-00

Zulässige Assurance Family Prüfungen	Prüfobjektgruppen (Target of Evaluation)	Maximales Assurance Family Level	Ausreichend für EAL (informativ)
ATE_COMP	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	7
AVA_VAN	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	5	7
AVA_COMP	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9 H1, H2, H3, SC, SB	1	7

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-20522-01-00

Verwendete Abkürzungen:

- DIN Deutsches Institut für Normung e.V.
- EN Europäische Norm
- IEC International Electrotechnical Commission – Internationale Elektrotechnische Kommission
- ISO International Organization for Standardization – Internationale Organisation für Normung

Code	Domain
N1	Network protocols
N2	Communication protocols
N3	Low-level interfaces
N4	Wireless
N5	Hardware components protocols
N6	Phone and VoIP
N7	Mobile networks
N8	Filtering
N9	Intrusion detection

Code	Domain
S1	Hardware architectures
S2	Personal computer and server security
S3	Embedded systems, microkernels
S4	Virtualization
S5	Applicative security
S6	Databases
S7	Web technologies

Code	Domain
H1	Secure hardware components architectures
H2	Hardware sensors, reactive technology
H3	Platforms and applications security

Code	Domain
SC	Smart Cards and similar devices
SB	Hardware devices with security boxes